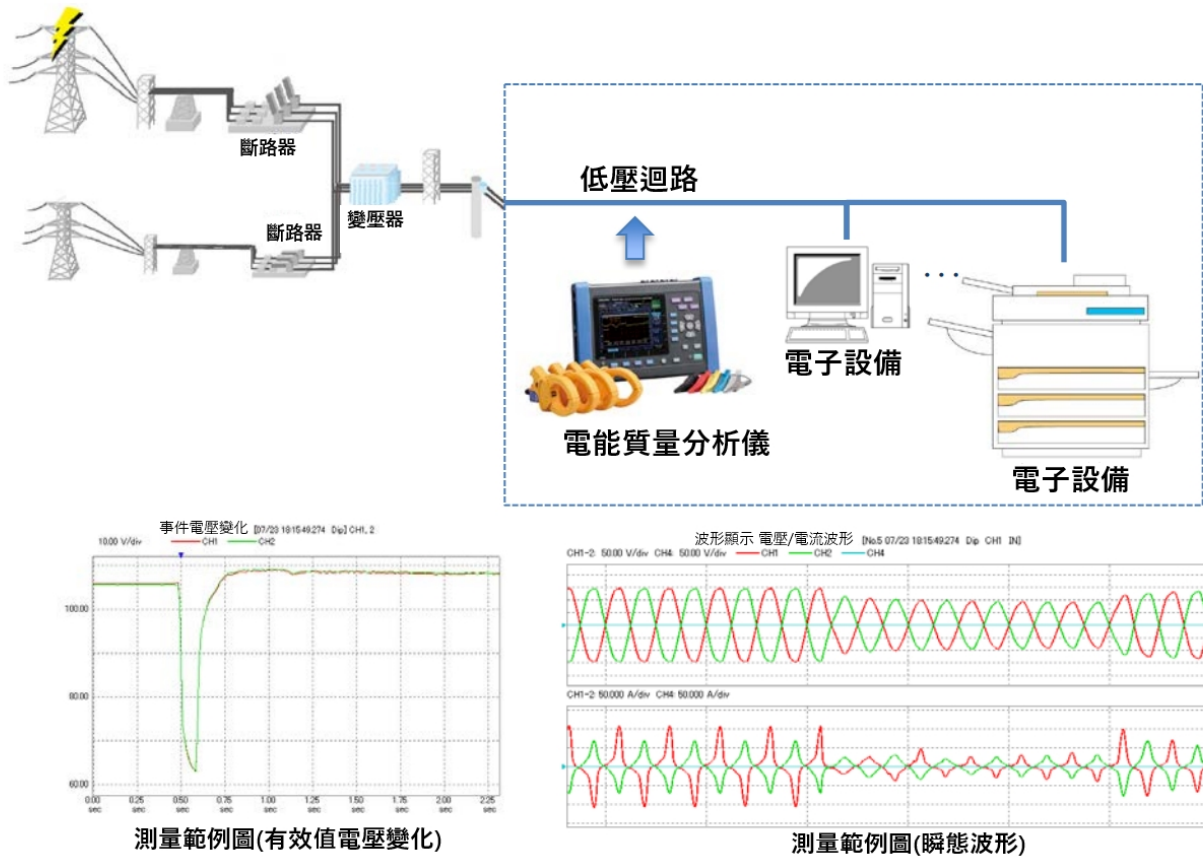


由打雷引起的低壓回路的電壓下降的測量 S0032-C03

使用電能質量分析儀，測量高壓系統由於打雷引起的電壓下降對低壓回路的影響。

要點

- 高壓系統發生由於雷擊造成的電壓下降是無法避免的。由此影響低壓回路也會出現電壓下降，因此需求方的對策是必需的。
- 要檢測電壓下降，電能質量分析儀的"下降"事件很有用。"下降"事件可檢測出電壓有效值低於閾值的情況。
- 發生"下降"事件的話，記錄事件發生前 0.5s，發生後 29.5s 之間的有效值變動、事件發生時 200ms 期間的暫態波形。



■PQ3198 和 PQ3100 的區別

- PW3198：記錄事件發生時的 200ms+前後 2 個波形部分的“瞬態波形”
- PQ3100：記錄時間發生前最大 1 秒、發生時 200ms、發生後最大 10 秒的“瞬態波形”

使用儀器

- 電能質量分析儀 PQ3198-92 (600A 傳感器 4 個的套裝，標配 PC 應用軟體)
- 電能質量分析儀 PQ3198-94 (6000A 傳感器 4 個的套裝，標配 PC 應用軟體)

電能質量分析儀 PQ3100-91 (600A 傳感器 2 個的套裝, 標配 PC 應用軟體)

電能質量分析儀 PQ3100-92 (600A 傳感器 4 個的套裝, 標配 PC 應用軟體)

電能質量分析儀 PQ3100-94 (6000A 傳感器 4 個的套裝, 標配 PC 應用軟體)

※ 記載的內容是根據 2019 年 3 月發行的儀器型號。產品參數可能會有更改, 請以現在發行的為準。